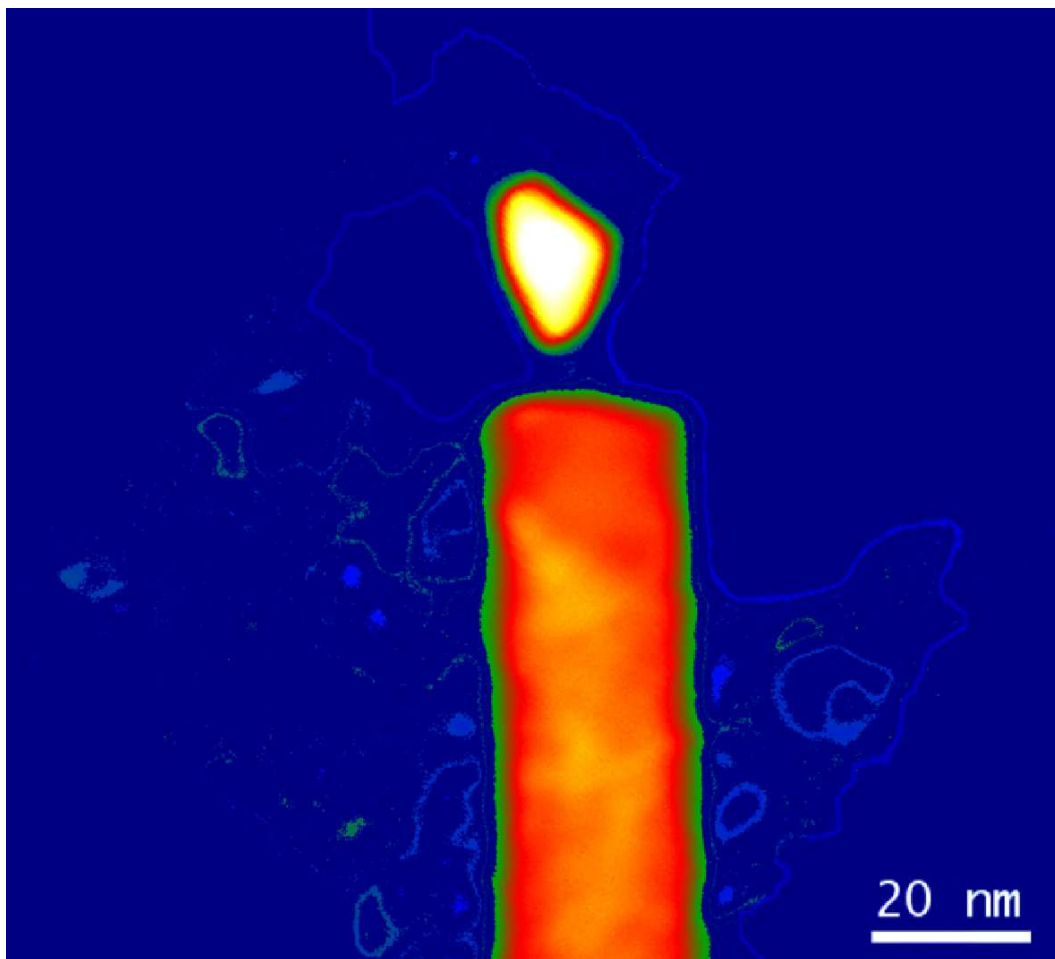


Nanoespelma

Sònia Estradé

MIND-IN2UB, Departament d'Electrònica, Universitat de Barcelona

sestrade@ub.edu



Imatge HAADF (camp fosc anular d'alt angle) en fals color d'un nanofil de Si d'uns 20 nm de diàmetre, obtinguda en un Jeol 2010F STEM (microscopi electrònic de transmissió de rastreig).

Si voleu que la vostra fotografia aparegui en aquesta pàgina envieu-nos-la a l'adreça electrònica revfis@iec.cat.

Condicions de publicació

La fotografia ha de tenir una mínima resolució de 600 dpi i una grandària de 15 cm. La fotografia es publicarà amb la llicència de Reconeixement de Creative Commons com la resta d'obres que apareixen a la *Revista*. Heu de ser-ne els autors o tenir-ne els drets per tal que ens n'autoritzeu la publicació i l'aplicació de la corresponent llicència. En enviar-nos la fotografia accepteu aquestes condicions i ens n'autoritzeu la difusió.